Search	Notes

	Contro	

Applicant(s)/Patent under Reexamination

10/509,226 Examiner

Kevin R. Kruer

1773

ONO ET AL. Art Unit

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
428	514	3/15/2006	кк
update	above	9/13/2006	KK
update	above	1/31/2007	КК
	·		
	1	1	I

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		<u> </u>	
		:	

SEAR (INCLUDING SI	CH NOT)
		DATE	EXMR
inventor search		3/18/2006	кк
east search		3/15/2006	KK
			:
	·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			